

<b>Prüfbericht-Nr.:</b> <i>Test Report No.:</i>	19630441.006	<b>Auftrags-Nr.:</b> <i>Order No.:</i>	1803342706	Seite 1 von 7 Page 1 of 7	
<b>Kunden-Referenz-Nr.:</b> <i>Client Reference No.:</i>	462043	<b>Auftragsdatum:</b> <i>Order date:</i>	23/07/2018		
<b>Auftraggeber:</b> <i>Client:</i>	SWELECT Energy Systems Limited, SWELECT HOUSE, No 5, Sir P.S. Sivasamy Salai, Mylapore, Chennai -600 004, India				
<b>Prüfgegenstand:</b> <i>Test item:</i>	Photovoltaic (PV) modules				
<b>Bezeichnung / Typ-Nr.:</b> <i>Identification / Type No.:</i>	HST72F335P/HST60F280P				
<b>Auftrags-Inhalt:</b> <i>Order content:</i>	Testing against PID resistivity				
<b>Prüfgrundlage:</b> <i>Test specification:</i>	Solar Photovoltaic Modules IEC TS 62804 – 1 : Test methods for the detection of potential-induced degradation – Part 1: Crystalline silicon with following severities - Climatic conditions: 85°C and 85% RH - Duration: 96 hours				
<b>Wareneingangsdatum:</b> <i>Date of receipt:</i>	13/08/2018 - 10/10/2018	Detaillierte Fotodokumentation siehe Anlage zu diesem Bericht  Detailed photo documentation see appendix to this report			
<b>Prüfmuster-Nr.:</b> <i>Test sample No.:</i>	Refer list of test samples				
<b>Prüfzeitraum:</b> <i>Testing period:</i>	16/10/2018 – 02/12/2018				
<b>Ort der Prüfung:</b> <i>Place of testing:</i>	Bangalore				
<b>Prüflaboratorium:</b> <i>Testing laboratory:</i>	TUV Rheinland(India) Pvt. Ltd., Bangalore, India				
<b>Prüfergebnis*:</b> <i>Test result*:</i>	Pass				
<b>geprüft von / tested by:</b>		<b>kontrolliert von / reviewed by:</b>			
06/02/2019	K. Ganesh Kamath/Manager-PV Products	06/02/2019	Kamalaksha CS/AGM -PV Products		
<b>Datum</b> <i>Date</i>	<b>Name / Stellung</b> <i>Name / Position</i>	<b>Unterschrift</b> <i>Signature</i>	<b>Datum</b> <i>Date</i>	<b>Name / Stellung</b> <i>Name / Position</i>	<b>Unterschrift</b> <i>Signature</i>
<b>Sonstiges / Other:</b> none					
<b>Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung:</b> <i>Condition of the test item at delivery:</i>		Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>			
* Legende: 1 = sehr gut    2 = gut    3 = befriedigend    4 = ausreichend    5 = mangelhaft P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)    F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)    N/A = nicht anwendbar    N/T = nicht getestet Legend: 1 = very good    2 = good    3 = satisfactory    4 = sufficient    5 = poor P(ass) = passed a.m. test specification(s)    F(ail) = failed a.m. test specification(s)    N/A = not applicable    N/T = not tested					
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.					

v04

<b>Prüfbericht-Nr.:</b> <i>Test Report No.:</i>	19630441.005	<b>Auftrags-Nr.:</b> <i>Order No.:</i>	1803342706	Seite 1 von 7 Page 1 of 7	
<b>Kunden-Referenz-Nr.:</b> <i>Client Reference No.:</i>	462043	<b>Auftragsdatum:</b> <i>Order date:</i>	23/07/2018		
<b>Auftraggeber:</b> <i>Client:</i>	SWELECT Energy Systems Limited, SWELECT HOUSE, No 5, Sir P.S. Sivasamy Salai, Mylapore, Chennai -600 004, India				
<b>Prüfgegenstand:</b> <i>Test item:</i>	Photovoltaic (PV) modules				
<b>Bezeichnung / Typ-Nr.:</b> <i>Identification / Type No.:</i>	HST72F355M/HST60F295M				
<b>Auftrags-Inhalt:</b> <i>Order content:</i>	Testing against PID resistivity				
<b>Prüfgrundlage:</b> <i>Test specification:</i>	Solar Photovoltaic Modules IEC TS 62804 – 1 :Test methods for the detection of potential-induced degradation – Part 1: Crystalline silicon with following severities - Climatic conditions: 85°C and 85% RH - Duration: 96 hours				
<b>Wareneingangsdatum:</b> <i>Date of receipt:</i>	13/08/2018 - 10/10/2018	Detaillierte Fotodokumentation siehe Anlage zu diesem Bericht  Detailed photo documentation see appendix to this report			
<b>Prüfmuster-Nr.:</b> <i>Test sample No.:</i>	Refer list of test samples				
<b>Prüfzeitraum:</b> <i>Testing period:</i>	16/10/2018 – 02/12/2018				
<b>Ort der Prüfung:</b> <i>Place of testing:</i>	Bangalore				
<b>Prüflaboratorium:</b> <i>Testing laboratory:</i>	TUV Rheinland(India) Pvt. Ltd., Bangalore, India				
<b>Prüfergebnis*:</b> <i>Test result*:</i>	Pass				
<b>geprüft von / tested by:</b>			<b>kontrolliert von / reviewed by:</b>		
06/02/2019	K. Ganesh Kamath/Manager-PV Products		06/02/2019	Kamalaksha CS/AGM -PV Products	
<b>Datum</b> <i>Date</i>	<b>Name / Stellung</b> <i>Name / Position</i>	<b>Unterschrift</b> <i>Signature</i>	<b>Datum</b> <i>Date</i>	<b>Name / Stellung</b> <i>Name / Position</i>	<b>Unterschrift</b> <i>Signature</i>
<b>Sonstiges / Other:</b>	none				
<b>Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung:</b> <i>Condition of the test item at delivery:</i>	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>				
<b>* Legende:</b>	1 = sehr gut P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	2 = gut F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	3 = befriedigend N/A = nicht anwendbar	4 = ausreichend N/T = nicht getestet	5 = mangelhaft N/T = nicht getestet
<b>Legend:</b>	1 = very good P(ass) = passed a.m. test specification(s)	2 = good F(ail) = failed a.m. test specification(s)	3 = satisfactory N/A = not applicable	4 = sufficient N/T = not tested	5 = poor N/T = not tested
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>					

vo4